

[구축사례]

하이테크 제품 결함 데이터 수집 및 분석 시스템 구축



Project Description

- 고객 : 하이테크 제품 설계/생산 및 파운드리 서비스 제공 기업 (D社)
- 솔루션 : Nexplant QMS(DMS)
- 범위 : Wafer Inspection, Review, Test 설비의 데이터 수집 및 분석
결함 패턴 분석, Shot 분석 등 기능 제공

01 The Challenge

- 시스템 노후화에 따른 속도 저하
기능 확장 및 고도화가 어려움
공장간 이원화된 시스템 관리비용 증가
- 시장 Needs에 대한 지속적 변화의 어려움
- 원청 고객사의 고품질, 단납기 요구
다양한 고객 요구에 대응
- 데이터 연계 분석 어려움

02 The Solution

- 공장간 통합 분석시스템 제공 및 확장 유연성 제공
- 다양한 분석기능 제공
Review 이미지 분석, Pattern 데이터 찾기
Chart & Gallery Analysis, Stack Map (Shot/Die) 분석
- 원청 고객 대응을 위한 설비, 품질데이터 취합기능 제공
Wafer Inspection, Review, Test 설비 데이터 수집/분석
- 공정 간 Defect Source 비교 분석을 통한
New Defect, Carryover Defect여부 분석

03 Benefits

- 공장(FAB1/FAB2) 간 DMS 및 Test 시스템 통합
시스템간 연계를 통한 운영 업무 효율성 증대
시스템 연간 유지비용, S/W 사용료 대폭 절감
- 다양한 분석기능을 활용하여 시장Needs에 빠르게 대응
- 원청사 요구에 다양한 데이터를 활용하여 신뢰도 향상
- Defect Source Data, Stack Map 분석을 통한
반복적 불량 발생 대폭 감소